



仕様	
型名	株式会社日立ハイテクサイエンス 環境制御型 E-sweep
走査範囲	150 μm × 150 μm, 20 μm × 20 μm
測定モード	AFM, DFM, MFM
観察像	二次電子像、反射電子像
付属装置	・ 環境制御ユニット, 到達真空度: 8.1×10^{-4} Pa